

# การลดของเสียในกระบวนการประกอบสายส่งสัญญาณทางแสง Defective Reduction in Active Optical Cable Assembly Process

# อาภานวล แก้วกาหลง<sup>\*</sup> และ จิรพัฒน์ เงาประเสริฐวงศ์

## Arpanual Keawkalong<sup>\*</sup> and Jeerapat Ngaoprasertwong

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University, Phayathai Road, Patumwan, Bangkok, Thailand 10330 \*E-mail: arpanual@hotmail.com, Tel.: +668-745-19691

# บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงกระบวนการประกอบสายส่งสัญญาณทางแสง (Active Optical Cable) ที่ระดับความเร็ว 100Gb/s ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการส่งสัญญาณสำหรับดาต้าเซ็นเตอร์ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยประยุกต์ใช้ เครื่องมือปรับปรุงคุณภาพตามแนวทางซิกซ์ ซิกมา หรือ DMAIC ประกอบด้วย (1) ระยะนิยามปัญหา (Define) พิจารณาอัตรา ผลิตผลดีในกระบวนการประกอบระดับออพติคอลเอนจิน แล้วเลือกกระบวนการที่มีอัตราผลิตผลดีต่ำที่สุดเพื่อดำเนินการ แก้ปัญหา (2) ระยะการวัด (Measure) เพื่อวิเคราะห์ความพ้องกันของระบบวัดสำหรับข้อมูลแบบนับ (Attribute gage R&R) (3) ระยะวิเคราะห์ (Analyze) หาสาเหตุของปัญหาจากการระดมสมองในทีมผู้เชี่ยวชาญ และการใช้เครื่องมือเช่น แผนภูมิ ก้างปลา วิธีผังแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Analysis) ตลอดจนการทดสอบทางสถิติเพื่อวิเคราะห์นัยสำคัญของแต่ ละปัจจัยต่อสัดส่วนของเสีย (4) การดำเนินการปรับปรุง (Improve) และ (5) การติดตามผล (Control) ซึ่งหลังการปรับปรุง พบว่าว่าสัดส่วนของเสียลดลงจาก 8.4% เหลือ 1.49% หรือลดลง 82% **คำสำคัญ:** การปรับแนวแกนแสงแบบแพสซิฟ; การลดของเสีย; ซิกซ์ ซิกมา

#### ABSTRACT

Active Optical Cable or AOC is commonly used for high-speed data transmission (100Gb/s) in many applications including Datacenter with continuous growth of demand. In order to make product price stay competitive in the market, manufacturing process need to have high efficiency and low cost. This research aims to improve AOC assembly process particularly in optical engine level with Six sigma methodology DMAIC which consist of 5 phases as follow, (1) Define phase to consider the most critical process and estimate improvement target. (2) Measure phase, to analyze accuracy and precision of measurement system.

(3) Analyze phase, to brainstorm possible causes and proceed statistical test to verify which input factor give significantly different to defective rate. (4) Improve phase to determine an effective solution for each factor, and the last (5) Control phase to follow up target achievement. As a result, the average defective rate is decreased from 8.4% to 1.49% or equal to 82% reduction. This research can achieve breakthrough improvement by conducting Six sigma approach.

Keywords: Passive alignment technique; Defective reduction; Six sigma

### 1. บทนำ

บริษัทกรณีศึกษาดำเนินธุรกิจรับจ้างผลิตและ ประกอบซิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (EMS : Electronics Manufacturing Services) ประเภทแผ่นวงจรพิมพ์ (Printed Circuit Board), แผงวงจรรวมหรือไอซี (IC), และ ผลิตภัณฑ์กลุ่มออพติค (Optics) ซึ่งนับเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ มีการเติบโตอย่างมากในช่วงปี 2561 มียอดขายโดยเฉลี่ยใน ปี 2562 ประมาณ 1.89 ล้านดอลลาร์/เดือน และยังคงมี แนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างผลิตภัณฑ์กลุ่ม ออพติค ได้แก่ สายแอคทีฟออพติคอลเคเบิล (Active Optical Cable: AOC) เป็นสายสำหรับรับส่งสัญญาณทาง แสงความเร็วสูง 100Gb/s ซึ่งใช้ในดาต้าเซ็นเตอร์

สาย AOC มี 2 ประเภท คือสายส่งสัญญาณ (Transmitter) หรือ Tx และสายรับสัญญาณ (Receiver) หรือ Rx มีระดับการประกอบหลัก 3 ระดับ ได้แก่

- การประกอบแผงวงจรรวม ด้วยเทคโนโลยี SMT (Surface Mount Technology)
- การวางตำแหน่งอุปกรณ์แอคทีฟ เช่น เลเซอร์ไดโอด ตัวขับเลเซอร์ รวมทั้งไมโครเลนส์ อาเรย์ลงบนแผงวงจรรวมด้วยเทคนิคการวาง ตำแหน่งที่มีความถูกต้องแม่นยำสูง (High Precision Alignment) เรียกว่าการประกอบออพ ติคอลเอนจิน (Optical Engine)
- การประกอบเส้นใยนำแสง เพื่อเป็นเส้นทางเดิน ของแสงเข้ากับออพติคอลเอนจินที่ผลิตได้จากข้อ
   2 ในกระบวนการรับและส่งสัญญาณด้วยแสง



ร**ูปที่ 1** กระบวนการประกอบสาย AOC แบ่งตามระดับการประกอบ

งานวิจัยนี้จะมุ่งเน้นเฉพาะการปรับปรุงกระบวนการ ประกอบระดับออพติคอลเอนจินสำหรับตัวส่งสัญญาณ หรือ Tx เอนจินเท่านั้น เนื่องจากมีความยากและซับซ้อนมากกว่า ในเชิงเทคนิค สามารถพิจารณาได้จากกราฟแสดงอัตรา ผลิตผลดี (%Yield) เปรียบเทียบกระบวนการประกอบตัวส่ง สัญญาณหรือ Tx เอนจิน และตัวรับสัญญาณหรือ Rx เอนจิน ดังรูปที่ 2 ซึ่งจะพบว่าการประกอบ Tx เอนจิน มีอัตราผลิตผลดีต่ำกว่า Rx เอนจินเสมอ



วัตถุประสงค์และขอบเขตงานวิจัยเพื่อลดของเสียใน กระบวนการประกอบสายส่งสัญญาณทาง มุ่งเน้นการลด ของเสียที่เกิดจากกระบวนการประกอบผลิตภัณฑ์ Tx ในระดับออพติคอลเอนจิน ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำหรับส่งข้อมูล ระยะใกล้ในดาต้าเซ็นเตอร์แบบ 12 ช่องสัญญาณ ที่ระดับ อัตราเร็วในการส่งข้อมูล 10 Gb/s ต่อช่องสัญญาณ

# 2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

#### 2.1 ทฤษฎี

ประยุกต์ใช้การปรับปรุงกระบวนการที่เป็นอยู่ใน ปัจจุบันให้ดีขึ้นตามแนวทาง DMAIC สามารถแตกออกได้ เป็น 5 เฟส ดังนี้ [1]

- การกำหนดปัญหา (Define Phase) ศึกษา กระบวนการประกอบ Tx เอนจิน และข้อบกพร่อง ที่เกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการเพื่อกำหนดปัญหา วัตถุประสงค์ตลอดจนขอบเขตของงานวิจัย
- การวัดเก็บข้อมูล (Measure Phase) ทำการ วิเคราะห์ความถูกต้องและความพ้องกันของ ระบบการวัด (Gage R&R Analysis) เพื่อให้การ วิเคราะห์ผลทางสถิตที่จะเกิดขึ้นในลำดับถัดไป ถูกต้องแม่นยำ เชื่อถือได้ และการวิเคราะห์ ความสามารถของกระบวนการ ในงานวิจัยนี้ เลือกใช้การพิจารณาความสามารถของ กระบวนการแบบข้อมูลนับ (Attribute Process Capability Analysis) ซึ่งเหมาะกับข้อมูลประเภท Pass/Fail
- การวิเคราะห์สาเหตุปัญหา (Analysis Phase) ระดมสมองตามแนวทาง 4M: Man, Machine, Material, Method โดยเลือกใช้แผนภูมิก้างปลา เพื่อวิเคราะห์หาปัจจัยนำเข้า และผังเหตุและผล (Cause and Effect Analysis) เพื่อคัดเลือกให้ เหลือปัจจัยที่มีแนวโน้มจะส่งผลต่อตัวชี้วัด และ การทดสอบสมมติฐานความมีนัยสำคัญทางสถิติ ของปัจจัยนำเข้าต่อตัวชี้วัด [2]
- การปรับปรุงกระบวนการ (Improve Phase) หา แนวทางแก้ไขปัญหา เช่น วิธีการควบคุมวัตถุดิบ ตลอดการปรับตั้งค่าเครื่องจักรให้เหมาะสม

5) การติดตามและควบคุม (Control Phase) ทดสอบเพื่อยืนยันผลหลังการปรับปรุง โดยใช้การ วิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการแบบ ข้อมูลนับอีกครั้งเพื่อติดตามผล รวมทั้งการกำหนด แผนการควบคุมและวิธีการปฏิบัติงานให้เป็น มาตรฐาน

# 2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

งานวิจัย [3] อธิบายขั้นตอนการประกอบตัวส่งและ รับสัญญาณแสงที่มีแพ็คเกจแบบ TOSA/ROSA ว่ามี 4 ขั้นตอนได้แก่ 1) การผลิตแผ่นวงจรรวม หรือ PCBA 2) การวางตำแหน่งเลเซอร์ VCSEL และ PD ด้วยเทคโนโลยี วางตำแหน่งระดับความแม่นยำสูง (High Precision Alignment) 3) การเชื่อมต่อวงจรด้วยลวดทองคำ 4) การ ครอบเลนส์เหนือตำแหน่งเลเซอร์ VCSEL โดยให้ตำแหน่ง กึ่งกลางของเลนส์ตำแหน่งแรกตรงกับกึ่งกลางของ VCSEL เลเซอร์ และกึ่งกลางของเลนส์ตำแหน่งสุดท้ายตรงกับ กึ่งกลางของตัวตรวจรับแสง (PD) ใช้กาวอีพ็อกซี่ที่เพื่อยึด เลนส์ให้ติดกับแท่นแสง (Optical Bench)

กระบวนการติดไดแบบความแม่นยำสูง สำหรับสาย แอคทีฟออพติคอลเคเบิลนั้น มี 6 ตัวแปรอิสระที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ความแม่นยำในแกน Z เป็นตัวกำหนดบอนด์ไลน์ (Bond Line) ความผิดพลาดในแนวแกน X, Y และมุมใน แกน Z ตามผลการทดลองจากงานวิจัย [4]

การศึกษาของ [5] ทำให้พบว่าความถูกต้องแม่นยำ ของการวางแนวแบบแพสซิฟจะถูกกำหนดด้วย ความสามารถในการตรวจจับชิพและการอ่านลักษณะเฉพาะ ของขอบ และการคำนวณระยะทางสัมพัทธ์ในลักษณะของ พิกเซลของภาพ ซึ่งสามารถแปลงกลับมาให้อยู่ในรูปแบบ ของระยะทางที่แท้จริง ความละเอียดในการวัดระยะจะถูก จำกัดด้วยกำลังขยายของกล้อง ความผันแปรของความสว่าง และสัญญาณรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์

งานวิจัยของ [6] อธิบายวิธีการประกอบแพคเกจทาง แสง เพื่อวางตำแหน่งไฟเบอร์เข้ากับแอคทีฟคอมโพเนนท์ มี 2 รูปแบบ ได้แก่ การวางตำแหน่งแบบแอคทีฟ (Active Optical Alignment) ซึ่งเป็นวิธีการดั้งเดิมและมีราคาแพง โดยที่ตัวงานจะต้องถูกจ่ายกระแสไฟฟ้าให้อยู่ในสภาวะที่ กำลังทำงาน (Operate) และใช้ข้อมูลเชิงสมรรถนะ เช่น จุดพีคของสัญญาณแสง เป็นข้อมูลป้อนกลับจุดที่เหมาะสม ในการวางตำแหน่ง และ การวางตำแหน่งแบบแพสซิฟ (Passive Optical Alignment) จะใช้การมองภาพ เอกลักษณ์ เป็นจุดอ้างอิงสำหรับการวางตำแหน่งไฟเบอร์ ดังนั้นคุณภาพของการวางตำแหน่งแบบแพสซิฟขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัยคือ จุดเอกลักษณ์ต้องมีลักษณะเด่นเพียงพอ และ เครื่องมือวางตำแหน่งมีความสามารถในการอ่านเอกลักษณ์ ได้อย่างถูกต้อง ข้อดีของการวางตำแหน่งแบบแพสซิฟ คือ ความเร็ว จึงนิยมใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต แต่ในทาง ปฏิบัติพบว่า การวางตำแหน่งแบบแพสซิฟจะให้ ประสิทธิภาพของแสงคู่ควบเฉลี่ย (Average Coupling Efficiency) ต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบการวางตำแหน่งแบบ แอคทีฟ

ผลการวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนของการวาง ตำแหน่งเลนส์แบบแพสซิฟเหนือเลเซอร์ VCSEL ของโมดูล สำหรับการส่งข้อมูลแบบความเร็วสูง 120Gb/s ของ [7] โดยทำการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง VCSEL ในแนวระนาบซึ่งก็ คือแกน X-Y และในแนวดิ่ง คือแกน Z ต่อการสูญเสียของ การคู่ควบแสง (Coupling Loss) พบว่า ความผิดพลาดใน การวางแนวในแกน X-Y ที่ระยะ ±10 µm จะทำให้เกิดค่า สูญเสียการคู่ควบ (Coupling loss) 1dB ในขณะที่แกน Z สามารถผิดพลาดได้ถึง ±60 µm จึงจะทำให้เกิดความ สูญเสียที่ 1dB ผลการทดลองนี้แสดงว่า การวางตำแหน่งใน แนว X-Y มีความสำคัญมากกว่าในแนวแกน Z

# 3. วิธีการวิจัยและผลการวิจัย

# 3.1 ระยะการนิยามปัญหา

พิจารณากระบวนการประกอบระดับออพติคอลเอนจิน มีขั้นตอนการทำงานย่อย 10 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การติดได 2) การเชื่อมวงจรไฟฟ้าด้วยเส้นลวดทอง 3) การทดสอบทาง แสงครั้งที่ 1 4) กระบวนการเบิร์นอิน 5) การทดสอบทาง แสงครั้งที่ 2 6) การวัดกำลังแสงขาออกก่อนวางเลนส์ 7) การตรวจสอบลักษณะภายนอกก่อนวางเลนส์ 8) กระบวนการวางเลนส์ด้วยเทคนิคการวางตำแหน่งแบบ แพสซิพ (Passive Alignment) ซึ่งใช้กาวอีพ๊อกซี่เป็นตัวยึด ให้เลนส์เกาะติดกับแท่นแสงบนแผ่นวงจรรวม 9) การวัด กำลังแสงขาออกหลังวางเลนส์ และลำดับสุดท้าย คือ 10) การตรวจสอบลักษณะภายนอก



**รูปที่ 3** ลำดับการประกอบ Tx ออพติคอลเอนจิน

เมื่อพิจารณาอัตราผลิตผลดี (Yield Rate) ของแต่ละ ขั้นตอนการประกอบในช่วงเดือนมกราคมถึงธันวาคม 2562 พบว่า กระบวนการวัดกำลังแสงขาออกหลังวางเลนส์มีอัตรา ผลิตผลดีต่ำและแปรปรวนที่สุด แสดงด้วยกราฟจุดวงกลม ซึ่งกระบวนการวัดกำลังแสงขาออกหลังวางเลนส์เป็นตัวชี้วัด คุณภาพของกระบวนการวางเลนส์ เพื่อที่จะปรับปรุง กระบวนการวัดกำลังแสงขาออก จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง วิเคราะห์ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการวางเลนส์ด้วย



เพื่อให้การประเมิน Baseline เป็นไปอย่างเป็นกลาง ผู้วิจัยเลือกใช้ข้อมูลในช่วง กรกฎาคม-ธันวาคม 2563 พบว่า มีอัตราผลิตผลดีเฉลี่ยอยู่ที่ 91.60% เท่ากับมีสัดส่วนของเสีย สูงถึง 8.4%

#### 3.2 ระยะการวัด

3.2.1 การวิเคราะห์ความถูกต้องและความพ้องกัน ของระบบการวัด ดังนี้

 กำหนดเครื่องทดสอบชิ้นงานที่ใช้ใน กระบวนการผลิตจริง ในขั้นตอนวัดกำลังแสงขาออก (Optical Power) ซึ่งประกอบด้วย 3 เครื่อง

 2) กำหนดจำนวนขึ้นตัวอย่างงาน และจำนวน ครั้งในการทดสอบซ้ำ โดยอ้างอิงจาก Fasser and Brettner แนะนำไว้ดังตารางที่ 1 ใช้ Tx เอนจินจำนวน 20 ตัวอย่าง โดยให้มี Tx เอนจินที่มีค่ากำลังแสงขาออกแบบผ่านสเปค ไม่ผ่านสเปค และแบบก้ำกึ่งหรือมาร์จินัล (marginal) อย่างละเท่า ๆ กัน

 3) ขั้นตอนการทดลองคือ เซ็ต Tx เอนจินลงบน เครื่องทดสอบชิ้นงาน เครื่องทดสอบจะจ่ายกระแสไฟฟ้าไป ที่ตัวงาน แล้ววัดกำลังแสงขาออกในแต่ละช่องสัญญาณ จากนั้นจะประเมินผลการทดสอบสุดท้าย คือ ผ่าน (Pass spec) หรือไม่ผ่าน (Fail spec) ดำเนินการวัดชิ้นงานซ้ำ 3 ครั้ง แบบถอดชิ้นงานและเซ็ตใหม่ทุกครั้ง โดยให้มีลำดับ อย่างสุ่ม

 4) บันทึกค่าการทดลอง และวิเคราะห์ระบบ การวัดของเครื่องทดสอบกำลังแสงขาออก

ตารางที่ 1 จำนวนชิ้นตัวอย่างงานในการประเมินผลระบบ การตรวจสอบข้อมูลนับ

จำนวนเครื่อง	จำนวนตัวอย่าง	จำนวนทดลองซ้ำ
ทดสอบ	ที่ต่ำที่สุด	ที่ต่ำที่สุด
1	24	5
2	18	4
≥3	12	3

#### ตารางที่ 2 ผลการประเมินระบบการวัด

หมายเลข	Kappa	Within	Appraiser Vs
เครื่องวัด	карра	Appraisers	Standard
1	0.92	90%	90%
2	1.00	100%	100%
3	0.96	95%	95%



**รูปที่ 5** ผลการวิเคราะห์ระบบการวัดสำหรับข้อมูลแบบนับ

จากผลการวิเคราะห์ที่แสดงในตารางที่ 2 และรูปที่ 5 พบว่า เครื่องทดสอบชิ้นงานทั้ง 3 เครื่องให้ผลการวัดซ้ำ (Within Appraisers) 90% ขึ้นไป แสดงว่า สามารถให้ผล การตัดสินแต่ละครั้งของการวัดซ้ำเหมือนกัน และการตัดสิน ถูกต้องตามค่าอ้างอิง (Appraiser vs Standard) เกิน 90% เช่นกัน แสดงว่า เครื่องทดสอบทั้ง 3 เครื่องสามารถดักจับ ชิ้นงาน ของดี ของเสียได้ตรงตามชิ้นงานอ้างอิง (Reference unit) นอกจากนี้ค่าสัมประสิทธิ์คัปปาที่มากกว่า 0.9 ในทุก เครื่องทดสอบ ยังสามารถบอกได้ว่าระบบวัดมีความพ้องกัน มาก [8]

# 3.3 ระยะการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา3.3.1 ระยะการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา

เลือกใช้แผนภูมิก้างปลา (Fish bond) วิเคราะห์ ตามหลักการ 4M ได้แก่ Man, Machine, Material และ Method ดังแสดงในรูปที่ 6



รูปที่ 6 การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาด้วยแผนผัง

จัดลำดับความสำคัญของสาเหตุของปัญหาโดย เมทริกซ์สาเหตุและผล (Cause and Effect Matrix) เพื่อ ประเมินปัจจัยนำเข้าที่มีแนวโน้มจะส่งผลต่อการเกิดของเสีย ที่กระบวนการวัดกำลังแสงขาออกโดยการให้คะแนนจาก คณะผู้เชี่ยวชาญ [9] ที่มีประสบการณ์ในกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์กลุ่มออพติคทั้งหมด 3 ท่าน เกณฑ์การให้คะแนน แสดงในตารางที่ 3 โดยคะแนนรวมคิดจากผลคูณของ คะแนนจากทั้งสามผู้เชี่ยวชาญ เนื่องจากให้น้ำหนักความ คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเท่ากันทั้ง 3 ท่าน

## ตารางที่ 3 เกณฑ์การให้คะแนนปัจจัยนำเข้า

เกณฑ์คะแนน	คำอธิบาย
0	ไม่ส่งผลต่อการเกิดของเสีย
1	ส่งผลต่อการเกิดของเสียเล็กน้อย
3	ส่งผลต่อการเกิดของเสียปานกลาง
9	ส่งผลต่อการเกิดของเสียอย่างมาก

ใช้กราฟพาเรโตดังรูปที่ 7 พิจารณาคะแนน และ เปอร์เซ็นต์คะแนนสะสมของปัจจัยนำเข้า เพื่อคัดกรอง สาเหตุของปัญหาที่จะถูกนำไปศึกษาในลำดับถัดไป



ร**ูปที่ 6** พาเรโตผลคะแนนของปัจจัยนำเข้าที่มีแนวโน้มส่งผลต่อการเกิดของเสีย

พบว่ามี 4 ปัจจัย ที่มีเปอร์เซ็นต์คะแนนสะสมมากกว่า 80% ของระดับคะแนนทั้งหมด ได้แก่

- อัลกอริทึมการหาเลนส์อไลน์เมนท์ออฟเซ็ต ไม่เหมาะสม
- แผ่นวงจรรวมที่ผลิตจากลูกค้าและที่ผลิตได้เอง ในบริษัทกรณีศึกษา มีระนาบของแท่นแสง แตกต่างกัน เมื่อใช้อไลน์เมนท์ออฟเซ็ตเดียวกัน อาจให้ระดับกำลังแสงขาออกไม่เท่ากัน
- ระนาบของเลนส์ในแกน Z ส่งผลให้ระยะห่าง ระหว่างเลเซอร์ VCSEL กับจุดรวมแสงของเลนส์ นูนห่างกันมากขึ้น ลำแสงจากเลเซอร์ VCSEL ถูก รวมผ่านเลนส์ได้น้อยลง ส่งผลให้ระดับกำลังแสง ขาออกลดลง
- คอนดิชันการอบกาวไม่เหมาะสม การยึดเกาะ ระหว่างกาวอีพ๊อกซี่ เลนส์ และแท่นแสงไม่ สมบูรณ์ มีโอกาสให้เลนส์ขยับ ส่งผลต่อกำลังแสง ขาออก

ปัจจัยเหล่านี้จะถูกนำไปวิเคราะห์หานัยสำคัญทางสถิติใน หัวข้อ 3.3.3 ถึง 3.3.6 โดยเลือกใช้วิธีการทดสอบสมมติฐาน สำหรับค่าสัดส่วนประชากร (Hypothesis test for two proportions)

# 3.3.2 การกำหนดขนาดตัวอย่างสำหรับทดสอบ สมมติฐาน

เนื่องจากสิ่งที่สนใจในการวิจัยนี้คือ สัดส่วน ของเสียที่กระบวนการวัดกำลังแสงขาออกของการประกอบ Tx เอนจิน ดังนั้น จึงเลือกใช้การทดสอบสมมติฐานสำหรับ สัดส่วนประชากร 2 กลุ่มซึ่งสามารถคำนวณจำนวนตัวอย่าง ที่เหมาะสมได้จากสมการ

$$n = \frac{(z_{\alpha}\sqrt{p_1(1-p_1)} + (z_{\beta}\sqrt{p_2(1-p_2)})^2}{(p_1 - p_2)^2}$$
(1)

ค่าเฉลี่ยสัดส่วนของเสียในปัจจุบัน p<sub>1</sub> เท่ากับ 0.084 และ สัดส่วนของเสียเป้าหมาย p<sub>2</sub> เท่ากับ 0.025 คือของเสีย ลดลง 70% ตามแนวทางของชิกซ์ ชิกมา ที่ระดับอำนาจการ ทดสอบ (Power) 0.90 เลือกเป็นการทดสอบแบบทางเดียว พบว่า ต้องใช้ขนาดตัวอย่าง 254 ตัวขึ้นไป

# 3.3.3 การวิเคราะห์ความแตกต่างของอัลกอริทึมใน การหาอไลน์เมนท์ออฟเซ็ต

กระบวนการวางเลนส์คือ การปรับแนวแกนแสง (Optical Alignment) ระหว่างเลเซอร์ VCSEL และเลนส์ ที่ส่งผลโดยตรงต่อระดับกำลังแสงขาออก กล่าวคือ ถ้า ตำแหน่งกึ่งกลางของบริเวณแอคทีฟของเลเซอร์ VCSEL กับเลนส์ตรงกัน Tx เอนจินก็จะมีกำลังแสงขาออกที่สูง ในทางตรงกันข้าม หากตำแหน่งของ VCSEL และเลนส์ คลาดเคลื่อนกัน ก็จะทำให้กำลังแสงขาออกต่ำลงหรือไม่มี กำลังแสงขาออกเลย เนื่องจากเลนส์ไม่สามารถรวมแสงที่ เปล่งจากบริเวณแอคทีฟเลเซอร์ VCSEL ได้ ความท้าทาย ของกระบวนการวางเลนส์คือ จะต้องทำให้เลเซอร์ VCSEL และเลนส์ทั้ง 12 ช่องสัญญาณตรงกัน เพื่อให้ Tx เอนจิน มีความสามารถในการส่งข้อมูลที่ระดับความเร็วรวม 100Gb/s ด้วยข้อดีของเทคนิคการทำเลนส์อไลน์เมนท์แบบ แพสซิพ คือความเร็วและราคาถูกเมื่อเทียบกับเทคนิคการ ทำเลนส์อไลน์เมนท์แบบแอ็กทิฟ ทำให้เทคนิคนี้ถูกเลือก มาใช้ในการกระบวนการผลิตในโรงงานกรณีศึกษา อย่างไร ก็ตาม วิธีการวางตำแหน่งเลนส์แบบแพสซิฟนี้ยังมีข้อจำกัด บางประการ คือ เครื่องจักรที่ใช้จะต้องมีความละเอียดและ ความแม่นยำสูงหลักการคือ เครื่องจักรจะอ่านภาพเลเซอร์ VCSEL ที่ช่องสัญญาณที่ 1 และ 12 ด้วยกล้องตัวบน (High power camera) จากนั้นคำนวณจุดกึ่งกลางระหว่าง ช่องสัญญาณที่ 1 และ 12 ของเลเซอร์ VCSEL ส่วนกล้องอีก ตัวจะทำหน้าที่อ่านภาพไมโครเลนส์อาเรย์จากมุมมอง ด้านล่าง (Bottom camera) ที่ช่องสัญญาณที่ 1 และ 12 โดยเทียบกับภาพอ้างอิงเช่นเดียวกัน แล้วคำนวณหาจด กึ่งกลางของเลนส์ระหว่างช่องสัญญาณที่ 1 และ 12 แสดง ด้วยกากบาทสีชมพูในรูปที่ 8



รูปที่ 7 หลักการวางตำแหน่งเลนส์ด้วยเทคนิคแพสซิพ

ลำดับถัดไป โปรแกรมจะวางตำแหน่งโดยให้กากบาท สีชมพูบนเลนส์และเลเซอร์ VCSEL ตรงกัน ถ้าซ้อนทับกัน พอดีถือเป็นตำแหน่ง (0, 0) แต่หากมีการตั้งค่า (X, Y) ตำแหน่งอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ (0, 0) เครื่องจักรก็จะคำนวณแล้ว เลื่อนเลนส์ไปในตำแหน่ง (X, Y) ให้ตรงตามที่ป้อนค่าไว้ใน เครื่องจักร เรียกค่า (X, Y) เหล่านี้ว่า อไลน์เมนท์ออฟเซ็ต (Alignment offset) มีหน่วยเป็น μm

ในอุดมคติการเล็งตำแหน่งกึ่งกลางของเลเซอร์ VCSEL เข้ากับกึ่งกลางของเลนส์ควรจะถือเป็นจุดที่ดีที่สุดแสงจาก VCSEL เดินทางเข้าสู่เลนส์ และแสดงผลเป็นค่ากำลังแสงขา ออกที่ผ่านข้อกำหนดของลูกค้าได้ แต่ในทางปฏิบัติ การผลิต เลนส์ที่มีความโค้งผิวแบบแอสเฟอริคัล (Aspherical lens) มีความซับซ้อนและคลาดเคลื่อนได้มาก จึงทำให้ไม่สามารถ ใช้ออฟเซ็ต (0, 0) µm แล้วได้กำลังแสงขาออกที่สูงพอจะ ผ่านข้อกำหนเฉพาะของลูกค้าได้ เลนส์ล็อตใด ๆ จะมีค่า อไลน์เมนท์ออฟเซ็ตเฉพาะซึ่งได้จากการทดลอง เรียกว่า การทดลองเพื่อหาอไลน์เมนท์ออฟเซ็ตที่เหมาะสม ซึ่งโดย ปกติการทดลองชนิดนี้จะเกิดขึ้นทุก ๆ ครั้งเมื่อเปลี่ยนเลนส์ ล็อตใหม่ หลักการคือทดลองวางตำแหน่งเลนส์ที่ค่าออฟเซ็ต (X, Y) ที่แตกต่างกัน แล้วติดตามกำลังแสงขาออกของงาน เหล่านั้น ตำแหน่ง (X, Y) ที่ให้กำลังแสงขาออกดีที่สุด ซึ่ง จะต้องประกอบด้วย 2 เงื่อนไขคือ กำลังแสงขาออกแต่ละ ช่องสัญญาณต้องสูงพอ และอยู่ในระดับสม่ำเสมอในทุก ๆ ช่องสัญญาณ (Linearity) จะถูกเลือกเป็นอไลน์เมนท์ออฟเซ็ต ของเลนส์ล็อตนั้น ๆ



รูปที่ 8 หลักการของการหาอไลน์เมนท์ออฟเซ็ต

ในอดีตเทคนิคการเลือกออฟเซ็ตยังไม่มีหลักการที่ แน่นอน เพียงแต่ทดลองวางเลนส์ด้วยออฟเซ็ตที่ต่างกัน 5-10 ออฟเซ็ต เมื่อเจอจุดที่กำลังแสงขาออกสูงพอและเป็น เส้นตรง ก็จะเลือกใช้ค่าออฟเซ็ตที่จุดนั้นเลย ยกตัวอย่าง การหาออฟเซ็ตด้วยวิธีเดิม วิศวกรทดลองทั้งหมด 6 ออฟเซ็ต ดังรูปที่10 ได้แก่ (-2,-5), (-1,-6), (-1,-5), (0,-5), (-1,-4), และ (-1,-2) แสดงผลกำลังแสงขาออกทั้ง 12 ช่องสัญญาณ ด้วยกราฟเส้น ซึ่งจะเห็นว่าการทดลองทำที่ระยะความกว้าง ในแกน X เพียง 2 µm และ 3 µm ในแกน Y โดยใช้ 4 ตัวอย่างในแต่ละจุด จากผลระดับกำลังแสงขาออกที่ได้จาก การทดลอง พบว่า จุด (-1, -5) µm มีเสถียรภาพของกำลัง แสงขาออกดีที่สุดในทุก ๆ ช่องสัญญาณ จึงเป็นจุดที่วิศวกร เลือกให้เป็นค่าอไลน์เมนท์ออฟเซ็ตของเลนส์ล็อตนี้ แต่ก็พบว่ายังมีของเสียเกิดขึ้นในขั้นตอนวัดกำลังแสงขาออก จำนวนมาก แม้ว่าจะวางเลนส์ด้วยค่า (X,Y) ที่คิดว่า เหมาะสมแล้วก็ตาม หรืออีกนัยหนึ่งคือ วิธีการนี้ยังไม่ เหมาะสมในทางปฏิบัติ



**รูปที่ 9** ผลการหาออฟเซ็ตด้วยวิธีการแบบเก่า

ทีมวิศวกรจึงพยายามปรับปรุงอัลกอริทึมการหา อไลน์เมนท์ออฟเซ็ตให้ดีขึ้นโดยมีแนวคิดว่า เพื่อให้การ เลือกใช้ออฟเซ็ตเป็นไปอย่างเหมาะสมถูกต้องแม่นยำ อย่างแท้จริง เราควรต้องทราบระยะใช้งาน (Processing window) ของเลนส์ ความหมายคือ การทดลองวางตำแหน่ง จะต้องเกิดในแกน X และ Y ที่กว้างพอจนเริ่มเห็นการ ถดถอยของกำลังแสงขาออก เพื่อให้มั่นใจว่าจุดออฟเซ็ต ที่เลือกอยู่ในบริเวณกึ่งกลางระยะใช้งาน ที่เมื่อรวมกับความ คลาดเคลื่อนของเครื่องจักรแล้วยังสามารถให้กำลังแสง ขาออกที่สูงและสม่ำเสมอได้ ตัวอย่างการใช้อัลกอริทึมใหม่ สำหรับหาอไลน์เมนท์ออฟเซ็ตสำหรับเลนส์ล์อต A เช่นเดียวกัน แต่วิธีการใหม่จะทดลอง โดยขยับตำแหน่งการ ปรับตั้งค่าออฟเซ็ตที่แกน X และ Y ทีละ 4 μm และทดลอง ช่วงออฟเซ็ตที่กว้างขึ้น ในกรณีนี้คือ 28 μm ในแกน X และ Y บริเวณที่เป็นเส้นตรง คือจุดออฟเซ็ตที่ให้กำลังแสงขาออก สม่ำเสมอทั้ง 12 ช่องสัญญาณสังเกตว่าจะอยู่ในลักษณะ เส้นตรง กรณีนี้คือที่ -5 μm ถึง 7 μm ในแกน X และที่ -10 μm ถึง 2 μm ในแกน Y แต่บริเวณที่กำลังแสงขาออกเริ่ม ถดถอย และเริ่มไม่เป็นเส้นตรง เป็นเส้นโค้ง หรือมีความชัน ยกตัวอย่าง



**รูปที่ 10** ผลการทดลองหาออฟเซ็ตด้วยวิธีการใหม่

- ตำแหน่ง (-1, -22) µm กราฟมีลักษณะโค้งคว่ำ คือช่องสัญญาณหัวและท้ายมีกำลังแสงขาออกต่ำ
- ตำแหน่ง (-1, 6) µm กราฟมีลักษณะโค้งหงาย คือช่องสัญญาณที่ 4-8 มีกำลังแสงขาออกต่ำ
- ตำแหน่ง (-9, -6) µm กราฟมีลักษณะยกสูงที่ ช่องสัญญาณแรก ๆ และลดต่ำในช่องสัญญาณ ท้าย ๆ
- ตำแหน่ง (11, -6) µm กราฟมีลักษณะลดต่ำที่ ช่องสัญญาณแรก ๆ และยกสูงในช่องสัญญาณ ท้าย ๆ

จากผลการทดลองหาอไลน์เมนท์ออฟเซ็ตด้วยวิธีการ ใหม่ วิศวกรเลือกออฟเซ็ต (0,-8) µm เป็นจุดที่เหมาะสม เพราะเป็นจุดที่เห็นแนวโน้มข้อมูลแล้วว่าอยู่กึ่งกลางย่าน ใช้งาน

จากนั้นทดลองวางตำแหน่งเลนส์ล็อตเดียวกันนี้ ด้วย ออฟเซ็ตที่ได้จากวิธีการเก่า คือ (-1,-5) µm และที่ได้จาก วิธีการใหม่คือ (0,-8) µm แล้วติดตามสัดส่วนของเสียที่ เกิดขึ้นที่กระบวนการวัดกำลังแสงขาออก

$$H_0: p_1 = p_2$$
  
 $H_1: p_1 > p_2$ 

โดยที่

p1 แทนสัดส่วนของเสียที่กระบวนการวัดกำลังแสงขาออก
 เมื่อติดเลนส์ด้วยออฟเซ็ตที่เลือกจากวิธีการเดิม
 p2 แทนสัดส่วนของเสียที่กระบวนการวัดกำลังแสงขาออก
 เมื่อติดเลนส์ด้วยออฟเซ็ตที่เลือกจากวิธีการใหม่

สัดส่วนของเสียที่กระบวนการวัดกำลังแสงขาออกถูก คำนวณดังสมการที่ 2

$$p = \frac{x}{n}$$
(2)

โดยที่

p คือ สัดส่วนของเสียที่กระบวนการวัดกำลังแสงขาออก
 x คือ จำนวนของเสียที่กระบวนการวัดกำลังแสงขาออก
 n คือ จำนวนงานทั้งหมดที่ทำการทดสอบ

ตารางที่ 4 การทดสอบสัดส่วนของเสียเมื่อใช้วิธีการหา ออฟเซ็ตวิธีการเดิมและวิธีการใหม่

อไลน์เมนท์	สถิติ				
ออฟเซ็ต	ทดสอบ	x	n	р	p-value
วิธีการเก่า (-1,-5)	$\mathbf{p}_1$	205	3873	0.053	0.000
วิธีการใหม่ (0,-8)	$p_2$	5	2077	0.002	0.000

<u>หมายเหตุ</u>

<u>x (ของเสีย : ชิ้น)</u>

<u>n (จำนวนตัวอย่าง : ชิ้น)</u>

#### <u>p (x/n)</u>

ผลการทดสอบทางสถิติพบว่า p-value = 0.000 น้อยกว่าระดับนัยสำคัญทางสถิติ **α** = 0.05 สามารถปฏิเสธ สมมติฐานหลักหรือ H<sub>0</sub> ได้ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ค่าออฟเซ็ต ที่ได้จากวิธีการหาออฟเซ็ตแบบเก่าให้สัดส่วนของเสีย มากกว่า การติดเลนส์ด้วยอไลน์เมนท์ออฟเซ็ตที่ได้จาก อัลกอริทึมแบบใหม่ ซึ่งเมื่อพิจารณารูปที่ 10 ก็จะเห็นว่า แม้ที่จุด (-1, -5) µm จะเป็นจุดที่มีกำลังแสงขาออกสูงและ ค่อนข้างสม่ำเสมอ แต่จุดออฟเซ็ตข้างเคียงซึ่งห่างกันเพียง แค่ 1 µm ในแนวแกน X ให้กำลังแสงขาออกที่ไม่คงที่ มีความแปรปรวน และหากพิจารณาร่วมกับความคลาด เคลื่อนที่อาจเกิดขึ้นได้จากเครื่องจักร (± 3 μm) ก็พบว่า มีโอกาสที่ตำแหน่งจะคลาดเคลื่อนไปเป็น (-2, -5) μm ได้ ตามสเปคความสามารถของเครื่องจักร จึงทำให้สัดส่วนของ เสียจากการใช้ออฟเซ็ต (-1, -5) μm สูงกว่าการใช้ออฟเซ็ต (0, -8) μm ซึ่งเป็นจุดกึ่งกลางของย่านใช้งาน ดังแสดงใน รูปที่ 11 หรืออาจกล่าวได้ว่าข้อมูลจากการหาอไลน์เมนท์ ออฟเซ็ตด้วยวิธีการแบบเก่าไม่เพียงพอที่ทำให้เกิดการ ตัดสินใจอย่างถูกต้อง

#### 3.3.4 ความแตกต่างของแผ่นวงจรรวม

กระบวนการประกอบ Tx เอนจินที่กล่าวไว้แล้ว ข้างต้น หลักสำคัญคือการวางองค์ประกอบแอ็กทิฟ (Active components) ได้แก่ เลเซอร์ VCSEL, ตัวขับสัญญาณ (Driver) ลงบน แท่นแสง (Optical bench) ซึ่งวางอยู่บน แผงวงจรรวม และเมื่อครอบเลนส์ลงบนแท่นแสงจะได้ ลักษณะดังรูปที่ 12 แท่นแสงทำหน้าที่เป็นส่วนฐานสำหรับ การวางเลนส์ ที่ส่งผลต่อระนาบของการวางเลนส์ และ ในท้ายที่สุดอาจส่งผลต่อระดับกำลังแสงขาออก



รูปที่ 11 อธิบายองค์ประกอบของ Tx เอนจิน

การทดลองนี้ทำการวัดระดับความสูงและระนาบของ แท่นแสงของแผ่นวงจรรวมที่ผลิตมาจาก 2 แหล่งที่แตกต่าง กัน ด้วยเครื่องมือวัดความละเอียดสูง Nikon NEXIV VMZ-R6555 ด้วยฟังก์ชัน AF เลเซอร์ เพื่อวัดระดับความสูงของ แท่นแสงเทียบกับระดับของแผ่นวงจรรวม ซึ่งแสดงด้วย ลูกศรสีแดงและสีน้ำเงิน ตามลำดับ ในตำแหน่งทั้ง 4 ได้แก่ A, B, C, และ D ดังรูปที่ 13



**รูปที่ 12** แสดงตำแหน่งการวัดความสูงของแท่นแสง เทียบกับแผ่นวงจรรวม

หาค่าเฉลี่ยจุด A และ B เพื่อเป็นตัวแทนความสูงแท่น แสงด้านบน และค่าเฉลี่ยจุด C และ D เป็นตัวแทนความสูง ของแท่นแสงด้านล่าง แล้วพล็อตกราฟค่าเฉลี่ยความสูงของ แท่นแสงระหว่างแผ่นวงจรรวมที่ผลิตจากลูกค้าและบริษัท กรณีศึกษา



ร**ูปที่ 13** ผลการวัดระนาบแท่นแสงและการจำลอง การวางตัวของแท่นแสงเลเซอร์ VCSEL และเลนส์

ทดลองติดเลนส์ด้วยเลนส์ล็อตเดียวกัน เครื่องจักร และอไลน์เมนท์ออฟเซ็ตเดียวกัน แล้วติดตามระดับกำลัง แสงขาออกของกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม ทดสอบว่าการที่ แท่นแสงมีการวางตัวไม่ขนานซึ่งเป็นลักษณะที่ปรากฏใน แผ่นวงจรที่ผลิตจากลูกค้า มีนัยสำคัญทางสถิติต่อสัดส่วน ของเสียมากกว่าเมื่อแท่นแสงวางตัวขนานหรือไม่

$$H_0: p_1 = p_2$$
  
 $H_1: p_1 > p_2$ 

#### โดยที่

p1 แทนสัดส่วนของเสียที่กระบวนการวัดกำลังแสงขาออก
 เมื่อใช้แผ่นวงจรรวมที่ผลิตโดยลูกค้า

p<sub>2</sub> แทนสัดส่วนของเสียที่กระบวนการวัดกำลังแสงขาออก ใช้แผ่นวงจรรวมที่ผลิตจากบริษัทกรณีศึกษา

ตารางที่ 5 ผลการทดสอบทางสถิติสัดส่วนของเสียที่เกิดจาก การใช้แผ่นวงจรที่ผลิตจากแหล่งที่แตกต่างกัน

แหล่งผลิตแผ่งเวงจร	สถิติ	v	n	n	n-velue
11111111111111111111111111111111111111	ทดสอบ	x	п	Р	p-value
จากบริษัทลูกค้า	$\mathbf{p}_1$	490	1960	0.250	0.000
จากบริษัทกรณีศึกษา	<b>p</b> <sub>2</sub>	101	3740	0.027	0.000

ผลการทดสอบทางสถิติ พบว่า p-value = 0.000 น้อยกว่าระดับนัยสำคัญทางสถิติ **α** = 0.05 สามารถปฏิเสธ สมมติฐานหลักหรือ H<sub>0</sub> ได้ สรุปได้ว่า สัดส่วนของเสียเมื่อติด เลนส์บนแผ่นวงจรรวมจากลูกค้ามากกว่าเมื่อติดเลนส์บน แผ่นวงจรรวมที่ผลิตจากบริษัทกรณีศึกษา แม้งานทั้งสอง กลุ่มจะใช้เลนส์อไลน์เมนท์ออฟเซ็ตเดียวกัน วิศวกรจึงทำ การปรับค่าอไลน์เมนท์ออฟเซ็ตเฉพาะให้สำหรับแผ่นวงจร จากลูกค้า พบว่า ของเสียลดลงจาก 25% เหลือ 3% แสดง ให้เห็นว่าการใช้แผ่นวงจรรวมที่มีระนาบของแท่นแสง แตกต่างกันก็สามารถควบคุมให้สัดส่วนของเสียน้อยลงได้ หากเลือกใช้อไลน์เมนท์ออฟเซ็ตที่เหมาะสม

## 3.3.5 ระนาบของเลนส์ในแนวแกน Z

ระนาบในแนวแกน Z หรือในเชิงเทคนิคการผลิต เรียก บอนด์ไลน์ (Bond line) เป็นตัวแปรสำคัญ ซึ่งถูก กล่าวถึงในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวางตำแหน่งแบบความ แม่นยำสูง (High Precision Alignment) แต่ในข้อกำหนด จากลูกค้า ไม่มีการกำหนดในหัวข้อนี้ และไม่เคยมีการ ควบคุมมาก่อน อย่างไรก็ตามนักวิจัยมีความสนใจต่อค่า คลาดเคลื่อนในแกน Z ที่ยังสามารถยอมรับได้ และไม่ส่งผล ให้เกิดของเสียที่กระบวนการวัดกำลังแสงขาออก ดำเนินการ หาเบสไลน์ของความสูงเลนส์ที่ยังให้กำลังแสงขาออกอยู่ใน เกณฑ์ที่ผ่านข้อกำหนดเฉพาะ โดยสุ่มงาน 100 ตัวที่ถูก ทดสอบว่ามีกำลังแสงขาออกผ่านข้อกำหนดเฉพาะ แล้ววัด ยืนยันความสูงของเลนส์เทียบกับแท่นแสงโดยใช้เครื่องมือ วัดความละเอียดสูง Nikon NEXIV VMZ-R6555 วัดความ สูงของของเลนส์ ที่ 4 ตำแหน่ง ได้แก่ A, B, C, และ D แสดง ด้วยลูกศรสีแดง เทียบกับระดับของแท่นแสง (Optical bench) ทั้ง 4 มุมแสดงด้วยลูกศรสีน้ำเงิน หาค่าเฉลี่ยจุด A และ B เพื่อเป็นตัวแทนความสูงของเลนส์ด้านบน และ ค่าเฉลี่ยจุด C และ D เป็นตัวแทนความสูงของเลนส์ด้านบน และ ค่าเฉลี่ยจุด C และ D เป็นตัวแทนความสูงของเลนส์ด้านอ่าง พบว่างานที่ผ่านข้อกำหนดเฉพาะทางกำลังแสงขาออก มีระดับความสูงของเลนส์เทียบกับแท่นแสงอยู่ที่ประมาณ 1810-1820 μm และความสูงแท้จริงของเลนส์มีค่าเท่ากับ 1800 μm



รูปที่ 14 การวัดความสูงของเลนส์เทียบกับแท่นแสง

งานวิจัย [7] ที่อธิบายความผิดพลาดในแกน Z ว่า ยอมรับได้ที่ ±60 µm แต่ค่าความคลาดเคลื่อนอาจมีความ แตกต่างกันได้ ขึ้นอยู่กับแหล่งกำเนิดเลเซอร์ที่ใช้ ความหนา ของได ตลอดจนระยะโฟกัสของเลนส์ จึงทดลองปรับตั้งค่า เครื่องติดเลนส์ให้บอนด์ไลน์มีค่ามากกว่า 1820 µm เพื่อ พิสูจน์ว่าความคลาดเคลื่อนที่เกินว่า 1820 µm ทำให้เกิด สัดส่วนของเสียที่มากขึ้นหรือไม่ ในกลุ่มตัวอย่างที่ปกติพบว่า ความสูงของเลนส์เมื่อเทียบกับแท่นแสงจะอยู่ในช่วง 1810-1820 µm และในกลุ่มตัวอย่างที่ความสูงของเลนส์ >1820 µm ดังแสดงในรูปที่ 16 และ 17 ตามลำดับ



**รูปที่ 15** กลุ่มตัวอย่างที่สูงของเลนส์ในแนวแกน Z อยู่ในช่วง 1810-1820 µm





ติดตามระดับกำลังแสงขาออกของกลุ่มตัวอย่างทั้งสอง เมื่อความสูงของเลนส์ในแกน Z เทียบกับแท่นแสงแตกต่าง กันสมมติฐานการทดสอบคือ

$$H_0: p_1 = p_2$$
  
 $H_1: p_1 > p_2$ 

โดยที่

p1 แทนสัดส่วนของเสียที่กระบวนการวัดกำลังแสงขาออก เมื่อความสูงของเลนส์ >1820 μm

p<sub>2</sub> แทนสัดส่วนของเสียที่กระบวนการวัดกำลังแสงขาออก เมื่อความสูงของเลนส์ อยู่ในช่วง 1810-1820 μm

**ตารางที่ 6** ผลการทดสอบทางสถิติสัดส่วนของเสียเมื่อความ สูงในแนวแกน Z ของเลนส์แตกต่างกัน

ความสูงของเลนส์ ในแนวแกน Z	สถิติ ทดสอบ	x	n	р	p-value
>1820 µm	$\mathbf{p}_1$	13	38	0.342	0.000
1810-1820 μm	$p_2$	5	1349	0.004	0.000

ผลการทดสอบทางสถิติพบว่า p-value = 0.000 น้อยกว่า ระดับนัยสำคัญทางสถิติ **α** = 0.05 สามารถปฏิเสธ สมมติฐานหลักหรือ H<sub>0</sub> ได้ ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า ความสูงของ เลนส์เมื่อเทียบกับแท่นแสงที่อยู่ในช่วง >1820 μm จะมี สัดส่วนของเสียที่กระบวนการวัดกำลังแสงขาออกสูงกว่าเมื่อ ความสูงของเลนส์อยู่ในระดับ 1810-1820 μm จากพื้นของ แท่นแสง เมื่อพิจารณาร่วมกับความสูงของตัวเลนส์เองที่มี ขนาด 1800 μm แสดงว่าค่าความคลาดเคลื่อนในแกน Z ที่ยอมรับได้คือ ≤20 μm



**รูปที่ 17** ภาพตัดขวางของ Tx เอนจิน แสดงให้เห็นการ วางตัวของเลนส์และเลเซอร์ VCSEL

สามารถอธิบายเหตุการณ์นี้ได้จากภาพตัดด้านข้าง (Cross-sectional) เมื่อระยะความสูงของเลนส์จากพื้นแท่น แสงมากขึ้น ทำให้ระยะห่างระหว่างจุดโฟกัสของเลนส์นูนกับ VCSEL เลเซอร์มากขึ้นตามไปด้วย ด้วยคุณสมบัติของ ลำแสงเลเซอร์ที่สามารถบานออกตามธรรมชาติ (Diverge) ทำให้จะต้องมีลำแสงบางส่วนสูญเสียไปแสดงด้วยแถบสี เขียวในรูปที่ 18 (ข) เพราะเลนส์นูนไม่สามารถรวมแสงที่ เปล่งจากเลเซอร์ทั้งหมดเข้าสู่เส้นไฟเบอร์ได้ ส่งผลให้ระดับ กำลังแสงขาออกต่ำลง เลเซอร์ทั้งหมดเข้าสู่เส้นไฟเบอร์ได้ ส่งผลให้ระดับกำลังแสงขาออกต่ำลง

## 3.3.6 คอนดิชันการอบกาวให้แห้ง

ในกระบวนการติดเลนส์ Tx เอนจิน จะต้องผ่าน การเข้าอบเพื่อทำให้กาวอีพ๊อกซี่ที่ทำหน้าที่ยึดเลนส์ไว้กับ แท่นแสงแห้งสนิท ทำให้ชิ้นงานมีความแข็งแรง และป้องกัน การขยับของเลนส์ ก่อนส่งไปกระบวนการถัดไป แต่ เนื่องจากข้อมูลทางเทคนิคของกาวอีพ๊อกซี่ชนิดนี้ระบุ เงื่อนไขการอบกาวไว้ 2 เงื่อนไข ได้แก่

- อุณหภูมิ 80℃ เวลา 60 นาที ซึ่งเป็นคอนดิชัน ที่ใช้ในปัจจุบัน
- 2) อุณหภูมิ 150°C เวลา 30 นาที

ทีมวิศวกรจึงมีความสนใจว่า คอนดิชันการอบที่แตกต่างกัน จะส่งผลต่อความแข็งแรง และโอกาสที่ทำให้เลนส์ขยับได้ หรือไม่ จึงทดสอบอบกาวที่ 80°C และ 150°C แล้วทดสอบ ความแข็งแรงในแนวเฉือน (Shear strength) ที่ 2 เงื่อนไข คือ ในขณะที่ตัวงานอุณหภูมิ 25°C และทำให้ตัวงานร้อนขึ้น จนถึงอุณหภูมิ 90°C ขณะทดสอบเพื่อจำลองให้ตัวงานอยู่ใน สภาวะอุณหภูมิสูง ซึ่งเป็นระดับอุณหภูมิที่ตัวงานต้องผ่านใน กระบวนการประกอบถัด ๆ ไป จึงจำเป็นต้องทดสอบความ แข็งแรงแนวเฉือนที่สภาวะนี้ด้วย



**รูปที่ 18** ผลการทดสอบความแข็งแรงในแนวเฉือน

พบว่าที่อุณหภูมิ 25℃ ค่าความแข็งแรงไม่ต่างกันไม่ว่า งานจะเข้าอบจากอุณหภูมิ 80℃ หรือ 150℃ แสดงด้วยจุด สี่เหลี่ยมและวงกลม ตามลำดับ แต่เมื่อให้ความร้อนไปที่ ตัวงานประมาณ 90℃ ขณะทดสอบแรงเฉือน พบว่า ค่าความแข็งแรงลดลง แต่การเข้าอบที่อุณหภูมิ 150℃ ซึ่ง แสดงด้วยจุดข้าวหลามตัดจะให้ความแข็งแรงที่ดีกว่าการอบ ที่ 80℃ แสดงด้วยจุดสามเหลี่ยมหนึ่งเท่าตัว ผลการทดลอง นี้แสดงให้เห็นว่า การอบที่อุณหภูมิ 150℃ นาน 30 นาที ทำให้ความสามารถของกาวอีพ๊อกซี่ในการยึดเกาะเลนส์ให้ อยู่กับแท่นแสงดีกว่า แม้ตัวงานจะอยู่ในสภาวะอุณหภูมิสูง

ดำเนินการศึกษาต่อด้วยการวิเคราะห์ภาพตัดขวาง (Cross sectional) ของตัวงานที่ถูกอบด้วย 80°C และ 150°C อย่างละ 5 ตัว โดยใช้กล้อง Nikon NEXIV VMZ-R6555 วัดว่าจุดกึ่งกลางเลนส์กับกึ่งกลางเลเซอร์ VCSEL วางตัวอยู่ในลักษณะอย่างไร ตัวอย่างรูปที่ 20 กากบาท เส้นทึบแทนตำแหน่งกึ่งกลางเลนส์ และกากบาทเส้นประ แทนตำแหน่งกึ่งกลางเลเซอร์ VCSEL รูปตัวอย่างนี้แสดงว่า เลเซอร์ VCSEL อยู่ห่างจากกึ่งกลางเลนส์ไปทางตำแหน่ง ล่างซ้าย หรือ (-X, -Y)



ร**ูปที่ 19** ภาพตัดขวางของเลเซอร์ VCSEL และเลนส์

พล็อตกราฟจุดตัดแกน X-Y (Scatter plot) เพื่อ พิจารณาแนวการวางตัวของเลนส์และเลเซอร์ VCSEL



จากภาพตัดขวาง

ผลการทดลองพบว่า การเข้าตู้อบที่อุณหภูมิ 150°C ซึ่งแสดงด้วยจุดวงกลม การวางตัวของเลนส์และ VCSEL จะ เกาะกลุ่มกว่าเมื่อเทียบกับการอบที่อุณหภูมิ 80°C แสดง ด้วยจุดสี่เหลี่ยมที่มี 2 ใน 5 ข้อมูลที่หลุดออกจากกลุ่ม ชี้ให้เห็นว่า การอบที่ให้เสถียรภาพในการยึดเกาะระหว่าง เลนส์และแท่นแสงมากกว่า คือที่ 150°C/30 นาที

ทดลองติดเลนส์โดยใช้เลนส์ล็อตและออฟเซ็ตเดียวกัน แต่นำเข้าอบที่คอนดิชัน 80°C/60 นาที และ 150°C/30 นาที แล้วติดตามสัดส่วนของเสียที่กระบวนการวัดกำลังแสง ขาออกของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม มีสมมติฐานการทดสอบ คือ

$$H_0: p_1 = p_2$$
  
 $H_1: p_1 > p_2$ 

#### โดยที่

p1 แทนสัดส่วนของเสียที่กระบวนการวัดกำลังแสงขาออก เมื่ออบกาวให้แห้งด้วย 80°C/60 นาที

p<sub>2</sub> แทนสัดส่วนของเสียที่กระบวนการวัดกำลังแสงขาออก เมื่ออบกาวให้แห้งด้วย 150°C/30 นาที

ตารางที่ 7 ผลการทดสอบทางสถิติสัดส่วนของเสียเมื่อเข้า อบกาวที่คอนดิชันต่างกัน

คอนดิชันการอบกาว ให้แห้ง	สถิติ ทดสอบ	x	n	р	p-value
80 C/ 60 นาที	<b>p</b> <sub>1</sub>	124	4941	0.025	0.000
150 C/ 30 นาที	<b>p</b> <sub>2</sub>	29	2529	0.011	0.000

ผลการทดสอบทางสถิติ พบว่า p-value = 0.000 น้อยกว่าระดับนัยสำคัญทางสถิติ **α** = 0.05 สามารถปฏิเสธ สมมติฐานหลักหรือ H<sub>0</sub> ได้ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การอบกาวให้ แห้งด้วย 80°C/60 นาที ให้สัดส่วนของเสียมากกว่าเมื่อใช้ 150°C/30 นาที

สรุประยะวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาด้วยการทดสอบ ทางสถิติ พบว่าทั้ง 4 ปัจจัย ได้แก่ 1) อัลกอริทึมของการ หาอไลน์เมนท์ออฟเซ็ต 2) ระนาบของแท่นแสงบนแผ่นวงจร รวม 3) ระนาบของเลนส์ในแนวแกน Z 4) คอนดิชันการ อบกาวให้แห้ง ส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อสัดส่วนของเสียที่ กระบวนการวัดกำลังแสงขาออก

## 4. ระยะการปรับปรุงแก้ไขปัญหา

ดำเนินการปรับปรุงปัจจัยนำเข้าที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการวางเลนส์ ซึ่งผ่านการทดสอบทางสถิติแล้วว่า ส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อการเกิดของเสียที่กระบวนการวัด กำลังแสงขาออก ดังนี้

# 4.1 การปรับเปลี่ยนอัลกอริทึมการหาอไลน์เมนท์ออฟเซ็ต

กำหนดวิธีการหาอไลน์เมนท์ออฟเซ็ตด้วยวิธีการ มาตรฐาน คือ ทดลองวางตำแหน่งเลนส์ที่ออฟเซ็ตต่าง ๆ โดยให้มีค่าระยะจากด้าน -x ถึง +x และจาก -y ถึง +y กว้างอย่างน้อย 20 µm ติดตามผลการวัดกำลังแสงขาออก แล้วสร้างเป็นอไลน์เมนท์ออฟเซ็ตกริด (Grid) ดังแสดงแล้ว ในรูปที่ 11 เพื่อให้สามารถเห็นระยะใช้งาน (Processing window) ได้ชัดเจน อันเป็นเครื่องมือช่วยให้ตัดสินใจเลือก จุดอไลน์เมนท์ออฟเซ็ตได้อย่างถูกต้อง

# 4.2 การควบคุมแผ่นวงจรรวมที่มาจากแหล่งผลิตที่ต่างกัน

กำหนดให้ที่กระบวนการรับเข้า (Incoming process) ต้องแยกแผ่นวงจรที่ผลิตโดยลูกค้า และที่ผลิตเองภายใน ก่อนนำเข้ากระบวนการผลิต และกำหนดให้มีการปรับตั้ง ค่าอไลน์เมนท์ออฟเซ็ตอย่างเฉพาะเจาะจงสำหรับรองรับ การผลิต Tx เอนจินที่ใช้แผ่นวงจรรวมที่ผลิตจากลูกค้าและ แผ่นวงจรรวมที่ผลิตได้ในบริษัทกรณีศึกษา

# 4.3 การเปลี่ยนคอนดิชันอบกาว

เปลี่ยนคอนดิชันการอบกาวให้แห้งจาก 80°C/60 นาที เป็น 150°C/30 นาที ซึ่งเป็นคอนดิชันที่ผลการทดลองแสดง ให้เห็นว่าทำให้กาวอีพ๊อกซี่มีความสามารถในการยึดเกาะ เลนส์ให้อยู่กับแท่นแสงได้ดีกว่า

### 4.4 การควบคุมระนาบในแกน Z ของเลนส์

กำหนดให้สุ่มตรวจเซ็คระนาบของเลนส์ในแกน Z หรือบอนด์ไลน์ (Bond line) ก่อนเริ่มปฏิบัติงานในทุก ๆ กะ จำนวน 20 ตัว เพื่อเป็นมาตรการป้องกัน (Preventive action) โดยวัดระยะความสูง ของเลนส์เทียบกับแท่นแสง ของแผ่นวงจรรวมด้วยเครื่อง Nikon NEXIV VMZ-R6555 บันทึกผลการวัดลงในแบบฟอร์มที่วิศวกรจัดทำไว้ ความสูง ของเลนส์จากแท่นแสงต้องอยู่ในช่วง 1810-1820 μm และ เลนส์จะต้องวางตัวในลักษณะขนาน คือค่าเฉลี่ยความสูงของ เลนส์ด้านบนและด้านล่างจะต้องต่างกันไม่เกิน ± 15 μm



ร**ูปที่ 21** แบบฟอร์มการตรวจเช็คความสูงของเลนส์ ก่อนเริ่มปฏิบัติงานแต่ละกะ

อ้างอิงสรุปแนวทางการปรับปรุงแก้ไขปัจจัยนำเข้าแต่ ละปัจจัยจากตารางที่ 8

#### 5. ระยะการควบคุม

ติดตามสัดส่วนของเสียและอัตราผลิตผลดีของ กระบวนการวัดกำลังแสงขาออกในกระบวนการประกอบ Tx เอนจินหลังการปรับปรุง ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม-กันยายน 2563 พบว่า ค่าเฉลี่ยของสัดส่วนของเสียอยู่ที่ 1.49% อ้างอิงจากตารางที่ 9 ลดลงจากค่าเฉลี่ยก่อน ปรับปรุงซึ่งสูงถึง 8.4% คิดเป็น 82%

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบกระบวนการวางเลนส์ก่อนและหลังการปรับปรุงในแต่ละปัจจัยที่ส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อสัดส่วนของ เสียที่กระบวนการวัดกำลังแสงขาออก

ลำดับ	ปัจจัย	ก่อนปรับปรุง	หลังปรับปรุง
1	อัลกอริทึมการหาอไลน์เมนท์ออฟ เช็ต	หาจุดที่กำลังแสงขาออกสูงสุด • ความกว้างแกน X = 2 um • ความกว้างแกน Y = 4 um	หาจนเจอจุดที่กำลังแสงขาออกเริ่มลดลง (Edge) • ความกว้างแกน X = 20 um • ความกว้างแกน Y = 20 um
2	การควบคุมแผ่นวงจรรวมที่มาจาก แหล่งผลิตที่แตกต่างกัน	<ul> <li>ไม่มีการแยกแผ่นวงจรรวมของลูกค้าและที่ ผลิตได้จากโรงงานกรณีฑึกษาก่อนไหลเข้า กระบวนการประกอบ</li> <li>ใช้อไลน์เมนท์ออฟเซ็ดร่วมกัน</li> </ul>	<ul> <li>แยกแผ่นวงจรรวมของลูกค้าและที่ผลิตได้</li> <li>จากโรงงานกรณีพึกษาก่อนไหลเข้า</li> <li>กระบวนการประกอบ</li> <li>พิจารณากรหาอไลน์เมนท์ออฟเซ็ตแยกกัน</li> </ul>
3	ระนาบของเลนส์ในแกน Z (Bond line)	ไม่มีการควบคุม	<ul> <li>ควบคุมบอนด์ไลน์ในช่วง 1800-1820 um</li> <li>กำหนดให้สู่มวัดบอนด์ไลน์ทุกด้นกะ (Shiftiy)</li> </ul>
4	คอนคิชันการอบกาว	• 80 degC • 60 นาที	• 150 degC • 30 นาที

#### ตารางที่ 9 สัดส่วนของเสียหลังการปรับปรุงกระบวนการ

เดือน	พ.ค.	ນີ.ຍ.	ก.ค.	ส.ค.	ຄ.ຍ.
จำนวนงานขาเข้า	10525	6569	3160	1760	4370
จำนวนของเสีย	267	161	28	0	68
สัคส่วนของเสีย (%)	2.54	2.45	0.89	0.00	1.56



รูปที่ 23 แสดงอัตราผลิตผลดีในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังปรับปรุง พบว่ากระบวนการวัดกำลังแสงขาออกมี อัตราผลิตผลดีเฉลี่ยสูงขึ้น อยู่ที่ประมาณ 98.51% หลังการ ปรับปรุง

## 6. สรุปผลการดำเนินงานวิจัย

งานวิจัยฉบับนี้ประยุกต์ใช้แนวทางซิกซ์-ซิกมา เพื่อ ปรับปรุงกระบวนการประกอบสายส่งสัญญาณทางแสง (Active Optical Cable) ระดับออพติคอลเอนจิน (Optical Engine Assembly) สำหรับตัวส่งสัญญาณ (Tx) แบบ 12 ช่องสัญญาณที่ความเร็ว 10Gb/s ต่อช่องสัญญาณ หรือ ระดับความเร็วรวม 100Gb/s โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลด สัดส่วนของเสียที่กระบวนการวัดกำลังแสงขาออกหลังวาง เลนส์ ดำเนินงานวิจัยตามระยะการปรับปรุงที่แบ่งออกเป็น 5 ระยะ ได้แก่ ระยะการนิยามปัญหา (Define phase), ระยะการวัด (Measure phase), ระยะการวิเคราะห์หา สาเหตุของปัญหา (Analyze phase), ระยะการปรับปรุง (Improve phase), และระยะการควบคุม (Control phase) ได้ผลการแก้ไขปัญหาของเสียที่กระบวนการวัด กำลังแสงขาออกลดลงจาก 8.4% เหลือ 1.49% จึงสามารถ สรุปได้ว่า งานวิจัยบรรลุวัตถุประสงค์ สามารถลดของเสียใน กระบวนการประกอบสายส่งสัญญาณทางแสงด้วยแนวทาง ซิกซ์ ซิกมา

จุดพิจารณาประการหนึ่ง คืออัลกอริทึมใหม่จะใช้เวลา ในการทดลองมากกว่า ตารางที่ 10 แสดงเวลาที่เกี่ยวข้อง กับการหา อไลน์เมนท์ออฟเซ็ตซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วนคือ เวลาที่ใช้ติดเลนส์ และเวลาที่ใช้ในการวัดระดับกำลังแสงขา ออก ตารางที่ 10 คำนวณเวลารวมที่ใช้สำหรับการหาอไลน์เมนท์ ออฟเซ็ตแบบวิธีการเก่าและใหม่

เวลาที่ใช้ติดเลนส์ (วินาที/ตัว)	เวลาที่ใช้วั กำลังแสง (วินาที	ท์ดระดับ ขาออก /ตัว)	ເວລາຮວມ (ວີນາที/ຕັວ)	
70	18	0	250	
รูปแบบการหาอไลน์ เมนท์ออฟเซ็ต	จำนวน ออฟเซ็ต	จำนวน ตัวอย่าง/จุด	จำนวนตัว จ ทั้งหม	อย่าง เวลาที่ใช้ า (ชั่วโมง)
วิธีการเก่า	6	4	24	1.7
อัลกอริทึมใหม่	32	2	64	4.4

พบว่า อัลกอริทึมใหม่ต้องใช้จำนวนตัวอย่างมากกว่า แบบเก่าถึง 40 ตัว และต้องใช้เวลาในการทดลองมากกว่า วิธีการเก่าถึง 2.8 ชั่วโมง แต่หากเปรียบเทียบกับ ความสามารถในการลดของเสียจาก 5.2% เหลือ 0.2% ดัง แสดงในการคำนวณข้อ 3.3.3 แล้ว ถือว่าอัลกอริทึมการหาอ ไลน์เมนท์ออฟเซ็ตวิธีการใหม่คุ้มค่าที่จะดำเนินการ

#### เอกสารอ้างอิง

- Montgomery, D.C. Introduction to Statistical Quality Control. 6<sup>th</sup> edition, Massachusetts, John Wiley & Sons, Inc., 2009.
- [2] Billingsley, P., et al., Statistical inference for management and economics. 3rd edition. 1986, Boston: Boston : Allyn and Bacon. 1986.
- [3] Evans, D. D. Active Optical Cable Transceiver Packaging Trends and Die Bonding Case Studies. 2015 China Semiconductor Technology International Conference. March 15-16, Shanghai, China, 2015.
- [4] Evans, D. D. and Bok, Z. Micron Level Placement Accuracy Case Studies for Optoelectronic Products. 59<sup>th</sup> Electronic Components and Technology Conference, May 26-29, San Diego, California, UAS, 2009.
- [5] Tichem, M., van Gurp, J. F. C., Peters, T-J and Henneken, V. J. Micro-fabrication as Enabler for Sub-Um Photonic Alignment. 4<sup>th</sup> Electronic System-Integration Technology Conference, September 17-20, Amsterdam, Netherlands, 2012.
- [6] Boudreau, R., Passive optical alignment methods. 3<sup>rd</sup> International Symposium on Advanced Packaging Materials Processes, Properties and Interfaces. March 9-12, Braselton, GA, USA, 1997.
- [7] Hwang, S.H., Lim, J.W. and Rho, B.S. 120 Gb/s-level VCSEL Array Optical Subassembly Using Passive Alignment Technique. 58<sup>th</sup> Electronic Components and Technology Conference. May 27-30, Lake Buena Vista, FL, USA, 2008.

- [8] กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ. การวิเคราะห์ระบบการวัด (MSA) (ประมวลผลด้วย MINITAB). 5 edition, สมาคมส่งเสริม เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2546.
- [9] พลัฏฐ์กร ใจผ่องอัครกุล และนภัสสวงศ์ โอสถศิลป์. การลดปัญหาการแห้งสัมผัสของสีน้ำมัน. *วารสารวิศวกรรมศาสตร์* มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2019; 26(3): 197-213.